

お客様各位

NoiseKen

ノイズ研究所からのご提案

INS-S220 のデモ実施で 疑問や不安を解消しませんか？

「水俣条約」の発行を受け、水銀リレー方式のインパルスノイズ試験器から、新たに半導体リレー方式のインパルスノイズ試験器が開発されました。発売より45年、累計販売台数 7000 台を超え多くのお客様より

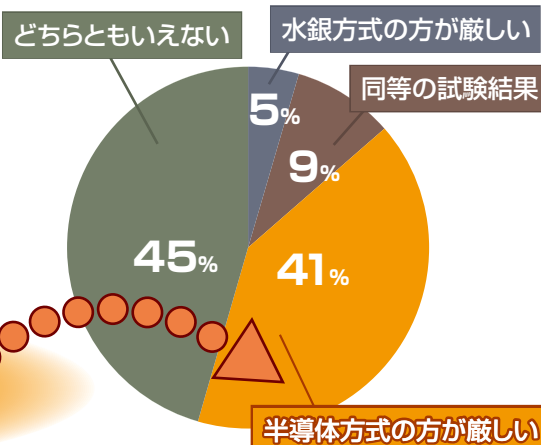
「ノイズの市場トラブルの問題解決には INS」

とお声を頂いており、期待が高まっています。

INS-S220を使用した事がないお客さまの声

- 半導体リレー方式だと立ち上がり時間が遅いから試験結果が甘くなるの？
- 半導体リレー方式では今までの試験の相関が取れないの？
- 試験結果が厳しくないのなら EFT/B 試験に変えてもよいのでは？

多くのお客さまが半導体リレー方式の試験結果が厳しいと判断しています。



実際に試験をしたお客さまの声



新しい試験器をお客さまの製品で是非、ご確認ください。

【ご注意】 ● 本カタログの全部または一部を無断で複製・転載することは禁止されています。 ● 製品の仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。 ● 諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。 ● ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、貴務については負いかねることがあります。 ● カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。 ● カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のもとでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。 ● 印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品には色や質感等での差異がある場合があります。 ● カタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植や誤記等など、お気付きの点がございましたら、弊社営業所までご連絡ください。

NoiseKen 株式会社ノイズ研究所

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1-4-4

ホームページアドレス <http://www.noiseken.co.jp>

- 首都圏営業所 TEL: 042-712-2031 Mail: syutoken@noiseken.com
- 東日本営業所 TEL: 048-866-0721 Mail: urawa@noiseken.com
- 中部営業所 TEL: 052-704-0051 Mail: nagoya@noiseken.com
- 西日本営業所 TEL: 06-6380-0891 Mail: osaka@noiseken.com

穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

URL: <https://www.hodaka.co.jp/>

本社: 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12

新横浜IKビル 9F TEL:045-595-9394

拠点: 横浜営業所、厚木営業所、東京営業所
名古屋営業所、三重営業所、浜松営業所
関西営業所、京都営業所、岡山営業所

INS-S220

インパルスノイズ試験器

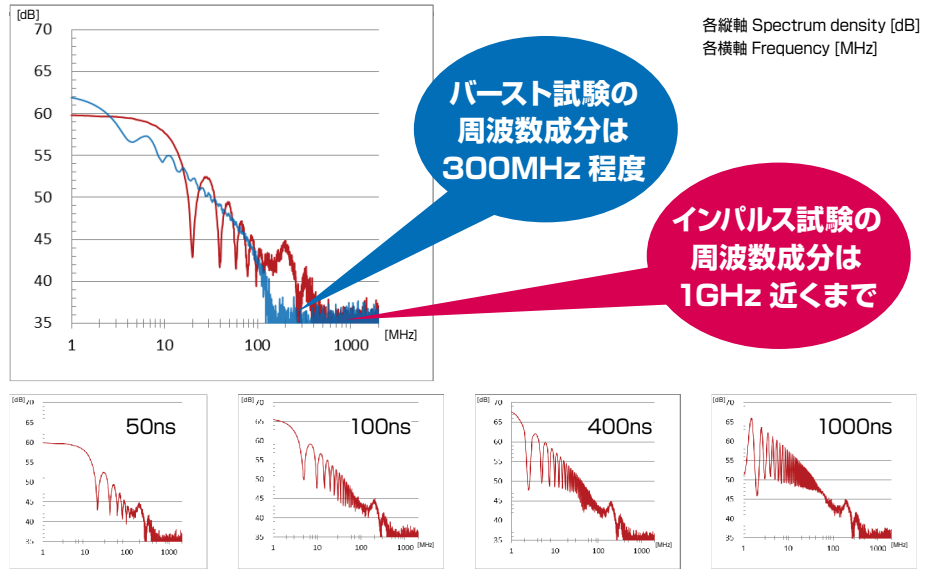
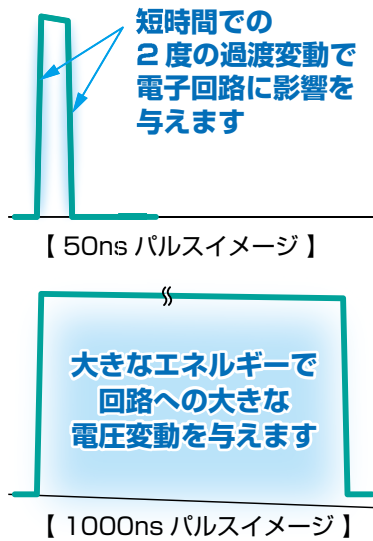
スイッチングデバイスの接点間の放電、電子モーターから発生するアーク放電などによる立ち上がりの早い高周波ノイズを模擬的に発生し、電子機器の耐性を評価する試験器です。試験パルスに含まれている周波数成分の幅が広く、また、パルス幅を変化させる事でエネルギー量も変化させることができるため、市場でのノイズトラブルに対して再現性の高いノイズ試験が行えます。



- パルス幅の設定が簡単：ボタン操作でパルス幅の設定が50ns ステップで行え、設定時間の短縮と接続ミスが軽減できます。
- 消耗品数（水銀リレーやパルス幅設定ケーブルなど）を減らしコスト削減ができます。（不整合パルスの発生抑制も）
- ショートプラグで、コモン／ノーマルモードの切換が簡単に、アウトレットパネルで試験品の接続も簡単です。
- 重畳ユニットの追加で、EUT 電源容量三相5線の試験もできます。（オプション）

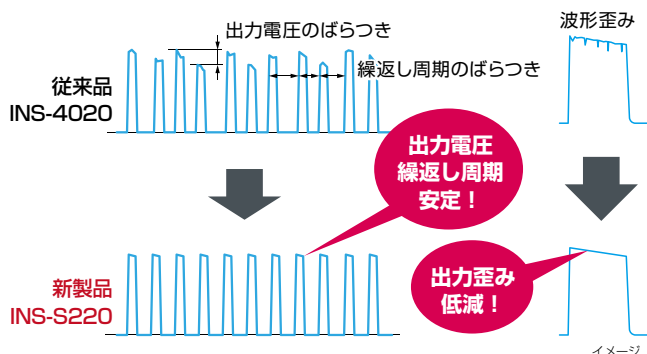
市場トラブルの問題解決 高周波、エネルギー量変化ができる試験パルス

パルス幅が狭い50ns～100ns程度のインパルスは、エネルギーが小さい代わりに短時間での立ち上がり／立下りの計2度の過渡変動による電圧変動、および急峻に発生する電磁界での誘導結合による影響を電子回路に与えます。
また、パルス幅の広い800ns～1000nsなどのインパルスはエネルギー量が大きいので、回路へ大きな電圧変動を与えやすくなります。
インパルス試験は国際規格IEC 61000-4-4で定められているファスト・トランジェント／バースト試験に比べ立ち上がり時間が高速なため、より周波数成分の高いのが特徴です。このためEUTに対してノイズを印加した際に、より回路内部に侵入しやすく電子回路に影響を与えやすくなります。
なお、インパルスのパルス幅により包含する周波数スペクトラムの成分および強度が異なるため、数種類のパルス幅での試験の実施をおすすめします。



再現性の向上 より定量的な試験ができます

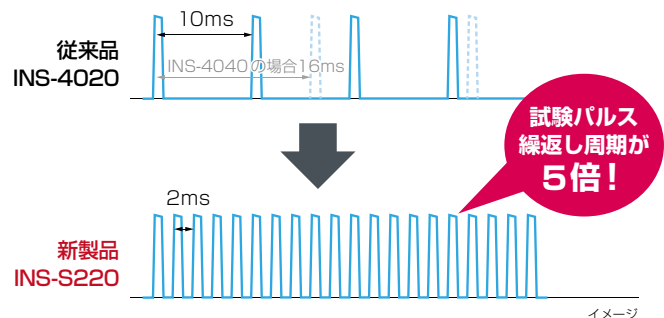
従来水銀リレー方式から半導体リレー方式に変更することで試験パルス波形の安定性が向上し、従来よりも定量的で再現性が高い試験ができます。また、水銀リレー劣化時に発生する出力波形不良も無くなりました。



誤動作発生率の向上 試験にかかる時間を短縮できます

試験パルスの繰返し周期を従来品より高速化することで、製品の誤動作発生率が向上し、試験時間の短縮が期待できます。

例) 繰返し周期を2msとした場合



※ パルス繰返し周期には制限があります。